# 3.3、检验的p值和最优检验的 概念

## 一、 检验的p 值

假设检验的结论通常是简单的:在给定的显著水平下,不是拒绝原假设就是保留原假设。然而有时也会出现这样的情况:在一个较大的显著水平( $\alpha$  =0.05)下得到拒绝原假设的结论,而在一个较小的显著水平( $\alpha$  =0.01)下却会得到相反的结论。

这种情况在理论上很容易解释:

因为显著水平变小后会导致检验的拒绝域变小,于是原来落在拒绝域中的观测值就可能落入接受域。

但这种情况在应用中会带来一些麻烦:假如这时一个人主张选择显著水平 $\alpha$ =0.05,而另一个人主张选 $\alpha$ =0.01,则第一个人的结论是拒绝 $H_0$ ,而后一个人的结论是接受 $H_0$ ,我们该如何处理这一问题呢?

例::一支香烟中的尼古丁含量X 服从正态分布  $N(\mu,1)$ ,质量标准 $\mu$  规定不能超过1.5毫克。现从某厂生产的香烟中随机抽取20支测得其中平均每支香烟的尼古丁含量为1.97毫克,试问该厂生产的香烟尼古丁含量是否符合质量标准的规定。

这是一个假设检验问题:

 $H_0: \mu \le 1.5, H_1: \mu > 1.5,$ 

采用u检验, 计算得:

$$u = \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{1.97 - 1.5}{1 / \sqrt{20}} = 2.10$$

对一些的显著性水平,下表列出了相应的拒绝域 和检验结论。

显著性水平	拒绝域	u=2.10对应的结论
$\alpha = 0.05$	<i>u</i> ≥1.645	拒绝 <i>H</i> <sub>0</sub>
$\alpha = 0.025$	<i>u</i> ≥1.96	拒绝 <i>H</i> <sub>0</sub>
$\alpha = 0.01$	<i>u</i> ≥2.33	接受 <i>H</i> <sub>0</sub>
$\alpha = 0.005$	<i>u</i> ≥2.58	接受 <i>H</i> <sub>0</sub>

我们看到,不同的 $\alpha$ 有不同的结论。

现在换一个角度来看,在 $\mu$ =1.5时,u的分布 是N(0,1)。此时可算得, $P(u \ge 2.10)$ =0.0179,若以0.0179为基准来看上述检验问题,可得

- $\Rightarrow$  当 $\alpha$ <0.0179时,u>2.10。于是2.10就不在  $\{u \ge z_{1-\alpha}\}$  中,此时应接受原假设 $H_0$ ;
- $\Rightarrow$  当 $\alpha \ge 0.0179$ 时, $u \le 2.10$ 。于是2.10就落在  $\{u \ge z_{1-\alpha}\}$ 中,此时应拒绝 $H_0$ 。

由此可以看出,0.0179是能用观测值2.10做出 "拒绝 $H_0$ "的最小的显著性水平,这就是P值。

定义: 在一个假设检验问题中,利用观测 值能够做出拒绝原假设的最小显著性水平称 为检验的p值。

引进检验的p 值的概念有明显的好处:

第一,它比较客观,避免了事先确定 显著水平;

其次,由检验的p 值与人们心目中的显著性水平 $\alpha$  进行比较可以很容易作出检验的结论:

- ▶ 如果 $\alpha \ge p$ ,则在显著性水平 $\alpha$  下拒绝  $H_0$ ;
- ightharpoons 如果 $\alpha < p$ ,则在显著性水平 $\alpha$ 下保留  $H_0$ .

p 值在应用中很方便,如今的统计软件中对检验问题一般都会给出检验的p 值。

下面给出一些常见形式的拒绝域所对应的 p 值计算式. 设检验统计量 T 为连续型变量,  $T_a$  表示 T 分布的下侧: 分位数, 检验的显著性水平为  $\alpha$ .

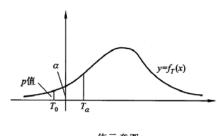
情形 1, 若检验的拒绝域为  $T \leq T_a$ ,

即有  $H_0$  为真时  $P(T \leq T_\alpha) = \alpha$ .

检验统计量的值为  $T_0$ ,则该检验的 p 值计算式为

$$p = P(T \leq T_0)(H_0 为 真条件下);$$

这时  $T_0 \leq T_a$  成立与  $p \leq \alpha$  成立等价.



p 值示意图

情形 2,若检验的拒绝域为  $T > T_{1-a}$ ,检验统计量的值为  $T_0$ ,则该检验的 P 值 计算式为

$$p = P(T > T_0)(H_0 为 真条件下);$$

情形 3,若检验的拒绝域为  $|T| > T_{1-\frac{6}{5}}$ ,检验统计量的值为  $T_0$ ,则该检验的 P值计算式为

$$p = P(|T| > |T_0|)(H_0 为真条件下).$$

#### 例 单个正态总体均值的检验问题

设  $X \sim N(\mu, 9)$ , 从 X 得到容量为 10 的样本均值为  $\overline{X} = 2.98$ , 检验假设  $H_0$ :  $\mu = 1$ , 检验水平  $\alpha = 0.05$ , 计算检验的 p 值.

#### 解 检验的拒绝域为

$$|U_0| = \left|\frac{2.98 - 1}{3}\sqrt{10}\right| = 2.09$$
,

 $|U| = \left| \frac{\bar{X} - 1}{3} \sqrt{10} \right| > z_{0.975} = 1.96,$ 

所以检验的 p 值

$$p = P(|U| > |U_0|) = P(|\frac{\overline{X} - 1}{3}\sqrt{10}| > 2.09)$$

$$= 1 - P(|\frac{\overline{X} - 1}{3}\sqrt{10}| \le 2.09)$$

$$= 1 - \Phi(2.09) + \Phi(-2.09)$$

$$= 2 - 2 \times 0.9817 = 0.0366.$$

由 p 值的意义可知当显著性水平  $\alpha$  降低到 0.036 6 时仍会做出拒绝的选择.

p 值可称为观测到的显著性水平.

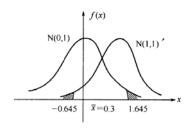
## 二、检验结果的实际意义

在假设检验中,原假设  $H_0$  与备择假设  $H_1$  虽是互补的,但地位是不对等的.

一般来说检验水平 α 是较小的,因而检验推断是"保护" 原假设,而"歧视"备择假设的.

为更好理解  $H_0$  与  $H_1$  地位的不对等性,举例如下.

对于 (2), 应取拒绝域  $W_2 = \{U \leqslant u_{0.05} = -1.645\}$ , 其中  $U = \frac{\overline{X} - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}}$ ; 由于  $u = \frac{0.3 - 1}{1/\sqrt{1}} = -0.7 > -1.645$ , 故接受  $H_0$ , 即认为  $\mu = \mu_1 = 1$ .



若  $\theta \in \Theta_0$ ,则犯第一类错误的概率为  $\alpha(\theta) \stackrel{\triangle}{=} P_{\theta} \{X \in W \mid \theta\};$  若  $\theta \in \Theta_0^c$ ,则犯第二类错误的概率为  $\beta(\theta) = P_{\theta} \{X \in \overline{W} \mid \theta\} = 1 - P_{\theta} \{X \in W \mid \theta\}.$ 

可见两类错误的概率是依赖于  $\theta$  和 W 的二元函数.

记 
$$P_{\theta}(X \in W) = P_{\theta}\{X \in W \mid \theta\}$$
, 定义

$$g(\theta) = P_{\theta}(X \in W) = \begin{cases} \alpha(\theta), & \theta \in \Theta_{0} \\ 1 - \beta(\theta), & \theta \in \Theta_{0}^{\epsilon} \end{cases}$$

为具有拒绝域 W 的势函数.

若给定常数  $\alpha(0 < \alpha < \overline{1})$ ,  $P_{\theta}(X \in W) \leq \alpha$ ,  $\theta \in \Theta_{\theta}$ 则称  $\alpha$  为拒绝域 W 的检验水平.

**例** 设总体  $X \sim N(\mu, 1)$ , 样本均值  $\bar{x} = 0.3$ , 样本容量 n = 1, 取  $\alpha = 0.05$ , 欲检验  $\mu_0 = 0$ , 还是  $\mu_1 = 1$ .

这里有两种假设提法,列出如下.

- (1)  $H_0$ :  $\mu = \mu_0$ ;  $H_1$ :  $\mu = \mu_1$
- (2)  $H_0: \mu = \mu_1; H_1: \mu = \mu_0$

对于 (1), 应取拒绝域  $W_1 = \{U \geqslant u_{0.95} = 1.645\}$ ,

其中 
$$U = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$
, 当  $H_0$  成立时,  $U = \overline{X} \sim N(0, 1)$ ,

由于 u=0.3<1.645, 故接受  $H_0$ , 即认为  $\mu=\mu_0=0$ .

# 三、两类错误和犯两类错误的概率、 最佳检验的概念

对假设  $H_0$ :  $\theta \in \Theta_0$ ;  $H_1$ :  $\theta \in \Theta_0$  的检验有可能犯错误

#### 假设检验中的两类错误

<b>供</b> 策	拒绝 H。	接受 H₀
H。为真	第一类错误	正确
H <sub>1</sub> 为真	正确	第二类错误

记检验的拒绝域为 W,则接受域为  $\overline{W}$ ; 记样本  $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ .

势函数的意义在于当 H。不真时,反映拒绝 H。的功效大小.因此,寻找 H。的最佳检验法,可归结为选择这样的拒绝域 W,当 H。不真时,使拒绝 H。的功效最大,即犯第二类错误的概率最小.

一般地当参数空间 $\Theta = \{\theta_0, \theta_1\}, \Theta_0 = \{\theta_0\}, \Theta_0^c = \{\theta_1\},$ 那么势函数

$$g(\theta) = \begin{cases} \alpha, & \theta = \theta_0 \\ 1 - \beta, & \theta = \theta_1 \end{cases}$$

**例** 设总体  $X \sim b(1,\theta)$ ,  $(X_1,X_2,\dots,X_5)$  是样本. 考虑检验  $H_0: \theta \leq \frac{1}{2}; H_1: \theta > \frac{1}{2}.$ 

第一种检验法: 当且仅当 5 次重复试验中均"成功"时,即  $\sum_{i=1}^{3} x_i = 5$  时,拒绝  $H_0$ .

此检验法的势函数:  $g_1(\theta) = P_{\theta}(\sum_{i=1}^{5} x_i = 5) = \theta^5$ . 当  $\theta \leq \frac{1}{2}$ ,计算得犯第一类错误的概率

$$\alpha(\theta) = g_1(\theta) \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 0.0312$$
,

当  $\theta > \frac{1}{2}$ , 犯第二类错误的概率  $\beta(\theta)$  太大( $g_1(\theta)$ 太小), 当且仅当  $\theta > \left(\frac{1}{2}\right)^{1/5} = 0.87$  时, $\beta(\theta) \leqslant 0.5$ .

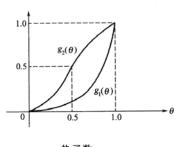
第二种检验法: 当  $\sum_{i=1}^{5} x_{i} = 3$  , 4 或 5 时 , 拒绝  $H_{0}$  .

此检验法的势函数: 
$$g_2(\theta) = P_{\theta}(\sum_{i=1}^{5} x_i = 3,4 \ \text{\bf y} \ 5)$$

$$= {5 \choose 3} \theta^{3} (1-\theta)^{2} + {5 \choose 4} \theta^{4} (1-\theta) + {5 \choose 5} \theta^{5}$$

对于  $\theta > \frac{1}{2}$ , 有较小的 第二类错误的概率  $\beta(\theta) = 1 - g_2(\theta)$ ,

但对于  $\theta \leq \frac{1}{2}$ , 却有较大的第一类错误的概率



势函数

例 设  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是来自总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的样本,  $\sigma^2$  已知,求对假设  $H_0$ :  $\mu=\mu_0$ ;  $H_1$ :  $\mu=\mu_1>\mu_0$  的 u 检验的势函数及两类错误的概率.

解 在此检验中, 拒绝域为  $(\overline{X} - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n}) \ge c$ , c 为大于零的任意常数. 此检验的势函数

$$\begin{split} \mathbf{g}\left(\boldsymbol{\mu}\right) = & \mathbf{P}_{\boldsymbol{\mu}} \left\{ \frac{\overline{X} - \mu_{0}}{\sigma / \sqrt{n}} \geqslant c \right\} = & \mathbf{P}_{\boldsymbol{\mu}} \left\{ \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \geqslant c + \frac{\mu_{0} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \right\} \\ = & 1 - \Phi \left( c + \frac{\mu_{0} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \right) \end{split}$$

当取检验水平为  $\alpha$  时,  $c=u_{1-\alpha}$ , 故

$$g(\mu) = 1 - \Phi \left( u_{1-a} + \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \right)$$

于是犯第一类错误的概率为:

$$g(\mu_0) = 1 - \Phi(u_{1-\alpha}) = \alpha$$
,

犯第二类错误的 概率为

$$\beta = 1 - g(\mu_1) = \Phi\left(u_{1-\sigma} - \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}\right)$$

$$g(\mu) = 1 - \Phi\left(u_{1-\alpha} + \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma}\sqrt{n}\right)$$

- (1) 设 $\alpha$ 、 $\beta$ 均已确定, 求样本容量 n.
- (2) 设 $\alpha = 0.05$ , 当 $\mu_1 = \mu_0 + 0.5\sigma$ , 欲使 $\beta \le 0.1$ , n 应取

解 (1) 
$$\beta = \Phi\left(u_{1-a} - \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}\right)$$
, 
$$u_{\beta} = u_{1-a} - \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma}\sqrt{n}$$
, 即  $n = \left[\frac{\sigma(u_{1-a} - u_{\beta})}{\mu_1 - \mu_0}\right]^2$ 

(2) 
$$g(\mu) = 1 - \Phi\left(u_{1-a} + \frac{\mu_0 - \mu}{\sigma}\sqrt{n}\right)$$
 得
0.  $05 = g(\mu_0) = 1 - \Phi(u_{0.95})$  故  $u_{0.95} = 1.645$ .  $\beta = 1 - g(\mu_0 + \sigma) = \Phi(1.645 - 0.5\sqrt{n}) \le 0.1$ , 0.  $5\sqrt{n} - 1.645 \ge 1.28$ ,解得  $n \ge 34.22$ ,取  $n = 35$  时,能在  $\alpha = 0.05$  下,使  $\beta \le 0.1$ .

## 最佳检验的概念

显著性检验只注重考虑控制犯第一类错误的概率.

Neyman 和 Pearson 提出了综合考虑控制犯两类错误概率的假设检验方法,它是一种较完善的假设检验方法.

其基本思想是:在控制犯第一类错误的概率条件下,使犯第二 类错误的概率达到最小. 设原假设和备择假设分别为  $H_0: \theta \in \Theta_0$ ;  $H_1: \theta \in \Theta_1$ , 检验统计量用 T 表示.

用统计量划分的接受域和拒绝域分别用  $\mathfrak{A}_0$ ,  $\mathfrak{A}_1$  表示, 犯第一类错误的概率和犯第二类错误的概率分别用  $\alpha$ ,  $\beta$  表示,

在  $P\{T \in \mathfrak{R}_1\} \leq \alpha, \theta \in \Theta_0$  条件下,找使  $P\{T \in \mathfrak{R}_1\}$ 尽可能大 (即接近  $\alpha$ )的 检验.从而使犯第二类错误的概率达到最小. 即找使下式成立的检验:

$$\sup_{\alpha \in \mathcal{O}_{\alpha}} P \{ T \in \mathfrak{R}_1 \} \leq \alpha.$$

## 例 单个正态总体均值的检验问题

设  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ,  $\sigma^2$  已知, 从 X 得到的样本为  $X_1, X_2, \dots, X_n$ , 检验假设  $H_0$ :  $\mu \ge \mu_0$ .

解 拒绝域形式为  $\bar{X} < c$ ,

$$\begin{split} \sup_{\mu \gg \mu_0} P\left( \, \overline{X} \, < \, c \right) &= \sup_{\mu \gg \mu_0} \Phi\left( \frac{c \, - \, \mu}{\sigma} \sqrt{n} \right) \, = \, \Phi\left( \frac{c \, - \, \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \right) \, = \, \alpha \, , \\ &\frac{c \, - \, \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \, = \, z_\alpha \, , c \, = \, \mu_0 \, + z_\alpha \, \frac{\sigma}{\sqrt{n}} , \end{split}$$

所以拒绝域为  $\overline{X} < \mu_0 + z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ , 即  $\overline{X - \mu_0} \sqrt{n} < z_\alpha$ ,

与显著性检验得到的一致.

例 单个正态总体方差的检验问题

设  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 从 X 得到的样本为  $X_1, X_2, \dots, X_n$ , 检验假设  $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ .

解 拒绝域形式为  $S^2 > c$ ,

$$\begin{split} &\sup_{\sigma^2 \leqslant \sigma_0^2} P\left(S^2 > c\right) = \sup_{\sigma^2 \leqslant \sigma_0^2} P\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > \frac{(n-1)c}{\sigma^2}\right) \\ &= \sup_{\sigma^2 \leqslant \sigma_0^2} \left[1 - F_{\chi^2(n-1)}\left(\frac{(n-1)c}{\sigma^2}\right)\right] \\ &= 1 - F_{\chi^2(n-1)}\left(\frac{(n-1)c}{\sigma_0^2}\right) = \alpha, \\ &\text{If } \bigcup \frac{(n-1)c}{\sigma_0^2} = \chi_\alpha^2 \left(n-1\right), \text{If } c = \chi_\alpha^2 \left(n-1\right) \frac{\sigma_0^2}{(n-1)}, \end{split}$$

所以拒绝域为

$$S^2 > \chi_{\alpha}^2 (n-1) \frac{\sigma_0^2}{(n-1)},$$

即 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ > $\chi_{\alpha}^2$ (n-1),与显著性检验得到的一致.

拒绝域形式给定的条件下局部最佳的

定义

对假设检验问题  $H_{\alpha}$ :  $\theta \in \Theta_{\alpha}$ :  $H_{\alpha}$ :  $\theta \in \Theta_{\alpha}$ . 记样本为  $\tilde{X} = (X_1, X_2, \cdots, X_n)'$ , 检验水平为  $\alpha$ , 考察样本的取值范围的划分, 取定的一种划分对应的接受域和拒绝域分别用  $\mathfrak{R}_0^*$ ,  $\mathfrak{R}_1^*$ 表示, 任意的一种划分对应的接受域和拒绝域分别用  $\mathfrak{R}_0^*$ ,  $\mathfrak{R}_1$ 表示, 满足下列两个条件:

$$(1) \sup_{\theta \in \Theta_0} P \mid \widetilde{X} \in \mathfrak{R}_1^* \mid \leq \alpha, \sup_{\theta \in \Theta_0} P \mid \widetilde{X} \in \mathfrak{R}_1 \mid \leq \alpha;$$

(2) 
$$P \mid \widetilde{X} \in \mathfrak{R}_0^* \mid \leq P \mid \widetilde{X} \in \mathfrak{R}_0 \mid , \theta \in \Theta_1$$
.

则称  $\mathfrak{R}_i^*$  为检验水平为  $\alpha$  的最佳拒绝域,对应的检验为最佳检验.

作业

P90: 14,15,16